

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004 年 7 月 22 日 (22.07.2004)

PCT

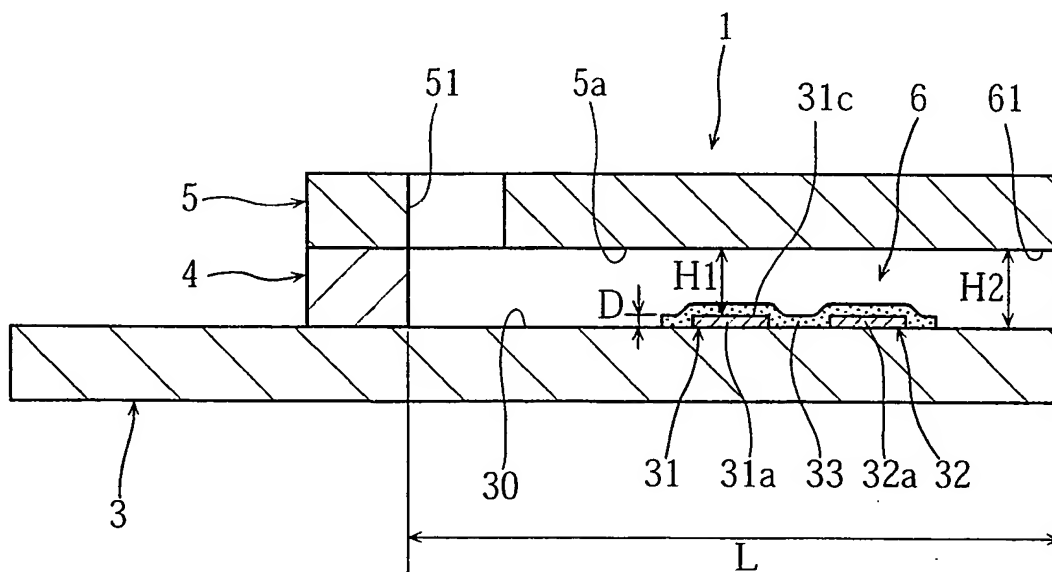
(10) 国際公開番号
WO 2004/061444 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G01N 27/327, C12M 1/34 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/016132 (75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 山岡 秀亮 (YA-
MAOKA, Hideaki) [JP/JP]; 〒601-8045 京都府 京都市
(22) 国際出願日: 2003 年 12 月 16 日 (16.12.2003) 南区東九条西明田町 5 7 アークレイ株式会社内 Ky-
oto (JP).
(25) 国際出願の言語: 日本語 (74) 代理人: 吉田 稔, 外 (YOSHIDA, Minoru et al.); 〒
(26) 国際公開の言語: 日本語 543-0014 大阪府 大阪市 天王寺区玉造元町 2 番
3 2-1 3 0 1 Osaka (JP).
(30) 優先権データ: 特願 2002-370930 (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB,
2002 年 12 月 20 日 (20.12.2002) JP BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE,
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): アーク DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
レイ株式会社 (ARKRAY, INC.) [JP/JP]; 〒601-8045 京 HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK,
都府 京都市 南区東九条西明田町 5 7 Kyoto (JP). LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,
MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD,

/続葉有/

(54) Title: THIN ANALYZING DEVICE

(54) 発明の名称: 薄型分析用具



(57) Abstract: An analyzing device (1) in which a reagent portion (33) is provided and which has a reaction space (6) for holding a sample liquid. The reagent portion (33) is constructed such that it dissolves when the sample liquid is held in the reaction space (6). Part of the reaction space (6) is defined by a first and a second face (31c, 5a) opposed to each other, and a facing distance (H1) of the first and the second face (31c, 5a) is set to 45 μ m or less. The facing distance (H1) is, for example, a minimum distance from an upper face (31c or 32c) of a first or a second electrode (31 or 32) to a portion (5a) of a second plate member (5), where the portion (5a) is a portion facing an upper face (31c or 32c) of an electrode (31 or 32).

(57) 要約: 本発明は、試薬部(33)が配置され、かつ試料液を保持するための反応空間(6)を備えた分析用具(1)に関する。試薬部(33)は、反応空間(6)に試料液が保持されたときに溶解するように構成されている。反応空間(6)の一部は、互いに対面する第1および第2面(31c, 5a)によって規定されており、第1および第2面(31c, 5a)の対面距離(H1)が45 μ m以下

/続葉有/

WO 2004/061444 A1



SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS,
MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特
許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッ
パ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK,

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。